# 自准校正透镜位于共轭后点前的凹非球面检验

赵鹏玮<sup>1,2</sup>,戚丽丽<sup>1</sup>,张金平<sup>1</sup>,郑列华<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>中国科学院上海技术物理研究所光电制造工程中心,上海 201800; <sup>2</sup>中国科学院大学,北京 100049

**摘要** 针对目前检验方法制约大口径、大相对孔径凹非球面反射镜的应用,提出一种基于贴合双透镜的大口径、大 相对孔径凹非球面检验方法。与 Offner 检验方法不同,检验光路中的透镜在反射前后的光路中分别作为校正透镜 和自准镜。根据三级像差理论推导初始结构,给出利用单透镜和贴合双透镜检验凹抛物面的残余像差曲线图,并 对其进行分析。实验结果表明,自准校正透镜位于共轭后点前的检验方法可以用于大口径、大相对孔径凹非球面 反射镜的检验。所提方法从加工、装配和使用等方面考虑更简单方便,为凹非球面检验提供新的思路,并且为利用 三透镜检验更大口径和相对孔径的凹非球面打下基础。

关键词 光学设计; 共轭校正; 非球面检验; 三级像差理论; 自准校正透镜; 场镜; 共轭前点的后校正
 中图分类号 O435.2 文献标志码 A doi: 10.3788/AOS202040.2022002

# Testing of Concave Aspheric Surface with Self-Collimating and Correcting Lens in Front of Back Conjugate Point

Zhao Pengwei<sup>1,2</sup>, Qi Lili<sup>1</sup>, Zhang Jinping<sup>1</sup>, Zheng Liehua<sup>1\*</sup>

 <sup>1</sup> Photoelectric Manufacturing Engineering Center, Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China;
 <sup>2</sup> University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

**Abstract** Because of the current testing methods restricting the application of large-aperture, large-relative aperture concave aspheric mirrors, a large-aperture, large-relative aperture concave aspheric surface testing method based on near-double-lens is proposed. Different from the Offner testing method, the lens in the testing optical path is used as a correcting lens and a self-collimating-lens in the optical path before and after reflection. The initial structure is derived according to the third-order aberration theory. The testing results of using a single lens and a near-double-lens as correcting lens are shown in diagrams respectively and analyzed. The experimental results show that the testing method in which the self-collimating lens is located in front of the conjugate back point can be used for the testing of large-aperture, large-relative-aperture concave aspheric mirrors. The proposed method is simpler and more convenient in terms of processing, assembly and use, and provides a new idea for the testing of concave aspheric surfaces, and lays a foundation for the use of three lenses to test concave aspheric surfaces with larger apertures.

**Key words** optical design; conjugate correction; aspheric surface testing; third-order aberration theory; selfcollimating and correcting lens; field lens; back correction on front conjugate point **OCIS codes** 220.1000; 220.1250; 220.4830; 220.4840

1引言

非球面反射镜因其具有十分优异的光学性能, 在一些大口径和高精度的光学系统中起到十分重要 的作用,并在空间大口径望远镜、空间遥感以及高能 激光系统中得到广泛应用。著名的哈勃空间望远镜<sup>[1]</sup>以及詹姆斯·韦伯空间望远镜<sup>[2]</sup>,其主镜和次 镜都采用的是非球面反射镜。为了获得更好的成像 效果,非球面反射镜的口径制作得越来越大,这对大 口径非球面反射镜的加工和检验带来巨大挑战。

收稿日期: 2020-05-26; 修回日期: 2020-06-28; 录用日期: 2020-07-06

基金项目:国家重点研发计划(2018YFB0504700)

<sup>\*</sup> E-mail: dimo818@126.com

大口径非球面反射镜的检验精度是影响其加工 质量的重要因素之一<sup>[3-4]</sup>。零位补偿法是一种高精度 的非球面检验方法,其中Offner方法是最常用的一种 检验方法,具有精度高和加工装调方便<sup>[5-8]</sup>等优点。 采用Offner方法检验大口径非球面反射镜,检验光路 较长,补偿法距差的能力无法满足检验的要求。折反 射补偿检验方法可以有效缩短检验光路的长度,提高 检验能力<sup>[9-11]</sup>。此外,计算全息法通过计算全息图生 成与待检面一致的波前<sup>[12-13]</sup>以实现高精度检验,子孔 径拼接法可以拓宽检验范围<sup>[14-15]</sup>,但这两种方法在加 工装调等方面较为复杂,限制了应用范围。

本文首现提出一种不同于零位补偿检验的方法。将自准校正透镜放置在待检非球面反射镜的共 轭后点前,用来实现凹非球面的检验,透镜背离待检 反射镜的一面为自准面,光路中的透镜同时起到校 正透镜、场镜和自准镜的作用。然后介绍所提方法 的原理以及初始光路的推导过程。最后对不同顶点 曲率半径的凹抛物面的计算结果进行介绍和分析。

# 2 原 理

从光轴上一点 O'发出的光线经过非球面反射镜 反射后,会聚在光轴上另一点 O'',如图 1 所示。这两 点是一对互为物像关系的点,彼此互为共轭点,其中 靠近待检非球面反射镜的点 O''为共轭前点,远离反 射镜的点 O'为共轭后点。点 O'和点 O''将光轴分成三个部分,使用罗马数字 I~III 分别表示前区、中区和后区。光学检验方法中,校正透镜位于共轭后点<math>O'前。检验光路如图 2 所示,其中数字 1~9 表示光 线在传播过程中依次经过的 9 个透射面或反射面。 同一个表面上的多个数字表示光线多次经过这个面,  $u_3$  为凹非球面反射面 3 的入射角, $u'_3$ 为凹非球面反 射面 3 的出射角, $u_5$  为自准校正透镜面 5 的自准角,  $l_5$  为反射面的前截距, $d_{23}$  为镜面 2 和 3 的间距。

从图 2 可以看到,自准校正透镜位于共轭后点 O'前,光线从光轴上点 O 发出,经过校正透镜面 1 和 2 折射后在共轭后点 O'处成虚像,经过共轭后点 O'的光线被待检反射镜 3 反射后成像在共轭前点 O"处,经过共轭前点 O"的光线入射到自准校正透镜 面 4 和 5,并在自准校正透镜面 5 处自准反射,使光 线沿原路返回。

检验光路中的前后两个共轭点并不是非球面的 消像差点,因此经过待检反射镜反射后的光线会产 生像差,这些像差可以使用自准校正透镜来校正。 所提的检验方法中,自准校正透镜靠近待检非球面



图 1 共轭点划分光轴的结果

Fig. 1 Result of dividing optical axis by conjugate points



Fig. 2 Schematic of testing optical path

的共轭后点,这是入射光线与光轴的一个交点,且光 线在校正透镜面1和2上的入射高度很小。因此在 光线被待检非球面反射前的光路中,自准校正透镜 可以作为场镜以校正系统中的高级球差,反射后的 光线经过待检反射镜的共轭前点并入射到自准校正 透镜,其可以校正反射镜产生的像差。由于共轭前 点和共轭后点在空间上是两个分开的点,因此自准 校正透镜在反射前后的光路中分别起到校正高级球 差和像差的作用。

# 3 公式推导

根据图 2 对公式进行推导,各参数的符号定义 符合几何光学的符号定义<sup>[16]</sup>。首先设定规化条件, 待检反射镜的曲率半径  $r_{03} = -1$ ,光线在待检反射 镜上的入射高度  $h_{03} = -1$ ,反射镜上下两端与近轴 曲率中心连线形成的角  $u_{03} = 1$ 。光线在自准校正 透镜面 4 的入射高度  $h_4$  与  $h_{03}$  的比值为口径比,即  $\alpha_1 = 0.1$ ,透镜的厚度  $d_{12} = 0.004$ ,光线在透镜面 2 上的入射高度  $h_2 = -0.004$ 。

光路中各个元件的折射率为 $n_1 = 1, n'_1 = n_2 = n$ ,  $n'_2 = n_3 = 1, n'_3 = n_4 = -1, n'_4 = n_5 = -n, n =$ 1.514664, $n_i$ 和 $n'_i$ 分别为第i面前和后介质的折射率。 待检凹非球面反射镜面 3 上光线的 $u_3 = u'_3$ ,以及光线 的前后截距 $l_3 = l'_3$ 的表达式为

$$u_{3} = \frac{2(h_{03} - h_{2})}{2h_{03} - (h_{2} + h_{4})}, \qquad (1)$$

$$u'_{3} = \frac{2(h_{03} - h_{4})}{2h_{02} - (h_{2} + h_{4})},$$
 (2)

$$l_{2} = h_{02}/u_{2},$$
 (3)

$$l'_{3} = h_{03} / u'_{3},$$
 (4)

式中: $h_i$ 为光线在第i面的入射高度; $u_i$ 为第i面的 自准角; $u'_i$ 为第i面的出射角。反射镜面 3 产生的 初级球差  $P_3$ 和高级球差  $K_3^{[17]}$ 的表达式为

$$P_{3} = \left(\frac{u'_{3} - u_{3}}{1/n'_{3} - 1/n_{3}}\right)^{2} \cdot \left(\frac{u'_{3}}{n'_{3}} - \frac{u_{3}}{n_{3}}\right), \quad (5)$$

$$K_{3} = \frac{(n'_{3} - n_{3}) e_{03}^{2}}{r_{03}^{3}}, \qquad (6)$$

式中: e<sub>03</sub> 为待检镜面 3 的偏心率。由于光线在透镜 面 1 和 2 上的入射高度很小,因此自准校正透镜面 1 和 2 校正像差的能力较弱,而面 5 为自准面,不会 产生像差。假设反射镜的像差全部由透镜面 4 来校 正,可以得到

$$h_{03}P_{3} + h_{03}^{4}K_{3} + h_{4}P_{4} = 0, \qquad (7)$$

式中:P4~P9为与初级球差有关的变量。然后根据

$$P_{4} = \left(\frac{u'_{4} - u_{4}}{1/n'_{4} - 1/n_{4}}\right)^{2} \cdot \left(\frac{u'_{4}}{n'_{4}} - \frac{u_{4}}{n_{4}}\right)$$
(8)

来求解自准角,即 $u_5 = u'_4$ 。根据几何光学公式可以 求解面4的前后截距 $l_4$ 和 $l'_4$ ,以及面3和4的间距 d<sub>34</sub>。并根据

 $(n'_4 - n_4)/r_4 = n'_4/l'_4 - n_4/l_4$  (9) 来求解面 4 的曲率半径  $r_4$ 。透镜面 2 的曲率半径  $r_2 = r_4$ 相同,即 $r_2 = r_4$ ,透镜面 2 的出射角 $u'_2 = u_3$ 相同,即 $u'_2 = u_3$ 。根据

 $h_2(n'_2 - n_2)/r_2 = n'_2u'_2 - n_2u_2$  (10) 来求解透镜面 2 的入射角  $u_2$ ,进而求解前后截距  $l_2$ 和  $l'_2$ 。面 5 为自准面,入射角  $u_5$  和出射角  $u'_5$  相 同,曲率半径  $r_5$  与反射面的前后截距  $l_5$  和  $l'_5$  相同, 光线在面 5 上的入射高度为  $h_5$ 。

从图 2 可以看到, r<sub>5</sub> 与面 1 的曲率半径 r<sub>1</sub> 相同。根据几何光学公式来求解光线在透镜面 1 上的入射高度 h<sub>1</sub> 和后截距 l'<sub>1</sub>,并根据

 $(n'_1 - n_1)/r_1 = n'_1/l'_1 - n_1/l_1$  (11) 来求解前截距  $l_1$ 。上述计算过程忽略由透镜面 1 和 2 产生的像差,在这一假设下计算得到的自准角  $u'_4$ 与实际值存在偏差。为了得到实际的各个参数值, 需要根据实际的像差公式,即

$$S_{1} = h_{1}P_{1} + h_{2}P_{2} + h_{03}P_{3} + h_{03}^{4}K_{3} + h_{4}P_{4} + h_{5}P_{5} + h_{6}P_{6} + h_{07}P_{7} + h_{07}^{4}P_{7} + h_{8}P_{8} + h_{9}P_{9},$$
(12)

简化后得到

$$S_{1} = 2(h_{1}P_{1} + h_{2}P_{2} + h_{03}P_{3} + h_{03}^{4}K_{3} + h_{4}P_{4}),$$
(13)

来计算光学系统的实际像差系数<sup>[18]</sup>,经过两次计算 后得到像差系数的差异,改变自准角 u<sup>'</sup>4 值并重新 计算光学系统的结构参数。重复这一步骤,直到实 际像差系数的改变量小于设定的误差值。式中:h<sub>07</sub> 为光线在面 7 上的入射高度。将规划结果输入 Zemax 软件中,经过优化后可以得到实际光路的参数。这一过程使用密接双透镜来代替自准校正单透镜,以提高校正像差的能力。自准校正透镜组的光 焦度为正,此时贴合双透镜的结构形式有三种,结构 如图 3 所示。经过计算发现,由正透镜和负透镜组 合的透镜组均可以得到很好的结果。



图 3 三种双贴合透镜。(a)两片正透镜;(b)正透镜在前面的正负透镜组;(c)负透镜在前的负正透镜组 Fig. 3 Three types of near-double-lens. (a) Two positive lenses; (b) positive and negative lens group with positive lens in front; (c) negative positive lens group with negative lens in front

# 4 实际光路设计

将计算得到的初始结构输入 Zemax 中,并根据 实际情况对结构进行缩放,以调整透镜入瞳的位置 和大小以及透镜的厚度。为了提高校正像差的能 力,将透镜从中间分开,从而形成两片密接的透镜。 在此基础上对透镜进行优化,设计一个口径为2m、 曲率半径为8m的抛物面反射镜的检验光路,口径 比为0.1,光路如图4所示。表1为结构参数,其中 OBJ、STP和IMA分别表示物面、光阑面和像面。

| Table 1 - Oystein parameters of testing optical parameters |          |            |               |        |              |       |
|--|----------|------------|---------------|--------|--------------|-------|
| No.  | Туре     | Radius /mm | Thickness /mm | Glass  | Diameter /mm | Conic |
| OBJ  | Standard | Infinity   | 14.00         |        | 0.00         | 0.00  |
| 1  | Standard | -17760.00  | 25.00         | K9     | 3.69         | 0.00  |
| 2  | Standard | 202.69     | 1.00          |        | 8.03         | 0.00  |
| 3  | Standard | 196.33     | 72.00         | K9     | 8.32         | 0.00  |
| 4  | Standard | -446.15    | 8416.48       |        | 20.70        | 0.00  |
| STP  | Standard | -8000.00   | -8416.48      | Mirror | 2007.55      | -1.00 |
| 6  | Standard | -446.15    | -72.00        | K9     | 201.36       | 0.00  |
| 7  | Standard | 196.33     | -1.00         |        | 201.78       | 0.00  |
| 8  | Standard | 202.69     | -25.00        | K9     | 200.00       | 0.00  |
| 9  | Standard | -17760.00  | 25.00         | Mirror | 199.43       | 0.00  |
| 10   | Standard | 202.69     | 1.00          |        | 200.01       | 0.00  |
| 11   | Standard | 196.33     | 72.00         | K9     | 201.78       | 0.00  |
| 12   | Standard | -446.15    | 8416.48       |        | 201.37       | 0.00  |
| 13   | Standard | -8000.00   | -8416.48      | Mirror | 2007.30      | -1.00 |
| 14   | Standard | -446.15    | -72.00        | K9     | 20.72        | 0.00  |
| 15   | Standard | 196.33     | -1.00         |        | 8.33         | 0.00  |
| 16   | Standard | 202.69     | -25.00        | K9     | 8.05         | 0.00  |
| 17   | Standard | -17760.00  | -14.00        |        | 3.71         | 0.00  |
| IMA  | Standard | Infinity   |               |        | 0.00         | 0.00  |





图 4 检验光路及局部放大图

Fig. 4 Testing optical path and partial enlarged view

整个光学系统残余像差的峰谷值  $W_{PV} = 0.0341\lambda$ , 均方根值  $W_{RMS} = 0.0120\lambda$ ,其中 $\lambda = 632.8$  nm。系 统的球差曲线如图 5 所示,  $W_{LA}$  为初级球差, H 为 光线在入瞳处的高度归一值,波像差如图 6 所示。

为了保证检验光路对加工和装调过程中产生的 误差不会过分敏感,降低加工装调的难度,对光学系 统的参数进行公差分析。各个参数的公差可以分为



图 5 球差曲线 Fig. 5 Spherical aberration curve



图 6 波像差图 Fig. 6 Wavefront map

两类,有光学元件的加工公差和装调光路引入的误差。针对加工误差,可以通过调整自准校正透镜组在 光路中的位置减小透镜公差对光路产生的影响。自 准校正透镜组的加工误差如表2所示。两片透镜的 偏心误差在0.05 mm 以内,倾斜角度小于10",透镜 折射率的精度为1×10<sup>-6</sup>,面形误差小于1/4 个光圈。

### 表 2 透镜组的公差范围

Table 2 Tolerance range of lens group

| •       |    |
|---------|----|
| 11n1t • | mm |
| anne.   |    |

| Parameter                         | Tolerance  |
|-----------------------------------|------------|
| $\Delta d_{12}$                   | $\pm$ 0.02 |
| $\Delta d$ $_{23}$                | $\pm 0.05$ |
| $\Delta d$ $_{34}$                | $\pm$ 0.02 |
| $\Delta r_1$                      | $\pm 10.0$ |
| $\Delta r_2$                      | $\pm$ 0.1  |
| $\Delta r_{_3}$                   | $\pm$ 0.1  |
| $\Delta r_{\scriptscriptstyle A}$ | $\pm$ 0.2  |

从表 2 可以看到,系统对于透镜组的公差要求还 是较为宽松的,目前的加工水平可以满足。装调过程 中要求透镜组的偏心误差小于 0.05 mm,倾斜角度小 于 10<sup>"</sup>。经过分析发现,透镜组上很小的倾斜角度和 偏心误差对检验光路的残余像差影响较小,目前在实 验室的水平下可以实现检验光路的装调。

# 5 分 析

#### 5.1 特点与优势

提出的检验方法使用的是凹非球面反射镜中两 个互为物像关系的点。检验光路中有实像点和虚像 点两个,分别位于待检反射镜近轴曲率中心的前后。 在 Offner 检验光路中只有一个实像点,补偿透镜位 于像点的后方<sup>[19]</sup>,并将其作为对比点。共轭校正非 球面检验光路中的一对共轭点将光轴分成三个区 域,沿着光线传播的方向分别设为后区、中区和前 区。所提的检验方法将自准校正透镜放置在共轭后 点前,即后区和中区的边界附近,这可以减小检验光 路的长度。由于自准校正透镜距离共轭前点的位置 较远,光路中经过共轭前点入射到自准校正透镜的 光线在透镜上的入射高度较高,此时自准校正透镜 可以校正光路中的像差,实现对共轭前点的后校正。 由于共轭后点与自准校正透镜的距离较近,光路中 经过共轭后点入射到自准校正透镜的光线在透镜上 入射高度很低,此时将自准透镜作为场镜。由于共 轭后点与共轭前点在空间中的位置不同,因此光路 中待检非球面反射镜反射前后的光线在自准校正透 镜上的入射高度也不同,使得自准校正透镜可以同 时作为校正镜和场镜来发挥作用。



所提方法可以在自准面上镀半反半透膜以实现 光线的自准反射,从而避免由自准校正透镜造成的 遮挡,实现对待检镜的全口径检验。实际检验过程 中,为了使自准校正透镜加工方便,也可以在自准面 上镀反射膜以实现光线的自准反射,在反射膜的中 心位置留一个可以使入射光线通过,且口径为毫米 量级的圆形不镀膜窗口,如图7所示,其中在斜线的 部分镀反射膜。为了使图像表示清楚,中间的圆形 窗口未按比例画出。



图 7 自准面上镀反射膜的示意图 Fig. 7 Schematic of reflective coating on self-collimating-surface

#### 5.2 自准校正单透镜的检验能力

使用单个透镜作为自准校正透镜,以 $W_{PV} < 0.2\lambda$ 为标准。在不同口径比的情况下,检验的最大口径以及最大相对孔径结果如图 8 所示,其中 $\phi$ 为最大口径,A为最大相对孔径, $\alpha$ 为口径比,R为顶点曲率半径。



图 8 单透镜的检验能力。(a)最大口径;(b)最大相对孔径

Fig. 8 Single lens inspection ability. (a) Maximum aperture; (b) maximum relative aperture

从图 8 可以看到,对于不同顶点曲率半径的待 检反射镜,其最大口径与口径比的关系呈近似线 性,随着口径比的增大,最大口径逐渐增大,但增 大的趋势较平缓,尤其是对于待检反射镜的顶点 曲率半径较小的情况。对比图 8(a)和图 8(b)可以 看到,当口径比固定时,随着顶点曲率半径的增 大,最大口径逐渐增大,最大相对孔径逐渐减小。 对于顶点曲率半径为4 m 的反射镜,在校正透镜 口径比为0.20的情况下,可以检验的最大口径为 634 mm,最大相对孔径为0.32。

#### 5.3 自准校正密接双透镜的检验能力

将密接的双透镜作为自准校正透镜,可以大大 提高光学系统的检验能力。密接双透镜有两种结构 形式,分别为正透镜在前面的正负透镜组以及负透 镜在前面的负正透镜组。无论是哪种组合方式,透 镜组的光焦度一定为正。图 9 和图 10 分别为两种 组合方式在不同口径比的情况下,可以检验的最大 口径和最大相对孔径的变化曲线。



#### 图 9 负正透镜的检验能力。(a)最大口径;(b)最大相对孔径

Fig. 9 Testing ability of negative and positive lenses. (a) Maximum aperture; (b) maximum relative aperture



图 10 正负透镜的检验能力。(a)最大口径;(b)最大相对孔径

Fig. 10 Testing ability of positive and negative lenses. (a) Maximum aperture; (b) maximum relative aperture

从图 9 和图 10 可以看到,对于不同的顶点曲率 半径,待检反射镜可检验的最大口径随着口径比的 变化趋势是相同的,随着口径比的增大,可检验的最 大口径与最大相对孔径逐渐增大。

对比图 9 和图 10 可以看到,当口径不变时,增 大顶点曲率半径可以增大最大口径,但最大相对孔 径逐渐减小。在相同的条件下,正负透镜组作为校 正透镜可以检验的最大口径和最大相对孔径较大。 对于顶点曲率半径为 4 m 的非球面反射镜,当校正 透镜口径比为 0.10 时,负正透镜组作为校正透镜可 以检验的最大口径为 1292 mm,最大相对孔径为 0.65,正负透镜组为作为校正透镜可以检验的最大 口径为 1404 mm,最大相对孔径为 0.7。

# 6 结 论

提出一种新的检验凹非球面反射镜的方法,与 Offner检验方法不同,将贴合双透镜作为自准校正 透镜,并位于待检反射镜的共轭后点前,背离待检镜 的一面为自准面。给出检验光路各参数的计算方 法,给出顶点曲率半径为8m、口径为2m的凹抛物 面反射镜的检验光路及设计结果,并进行公差分析。 对检验方法的特点进行详细介绍,并分析透镜口径 比的变化对检验能力的影响,以及不同曲率半径抛 物面的检验结果。实验结果表明,自准校正透镜位 于共轭后点前的检验方法可以用于大口径、大相对 孔径凹非球面的检验,并且对于中等口径的凹非球 面有十分出色的检验能力。

提出的检验方法在光路结构上与 Offner 检验 方法有很大不同。两个共轭点将光轴分为三个区 域,这三个区域分别定义为后区、中区和前区。位于 共轭点前后的自准校正透镜可以同时作为校正透镜 和场镜并起到校正像差的作用。由于检验光路的长 度较短,自准校正透镜的口径也较小,这为光路的加 工和装调提供方便。如果需要进一步提高透镜校正 像差的能力,以实现对超大口径、超大相对孔径凹非 球面的检验,可以在光路中加入第三片透镜。关于 第三片透镜的位置以及光路初始结构的计算方法, 将会在后续的实验中进行详细说明。

#### 参考文献

[1] Lallo M D. Experience with the Hubble Space Telescope: 20 years of an archetype [J]. Optical Engineering, 2012, 51(1): 011011.

- Lightsey P A, Charles A, Mark C, et al. James
   Webb Space Telescope: large deployable cryogenic
   telescope in space[J]. Optical Engineering, 2012, 51
   (1): 011003.
- Qi L L, Zheng L H, Ye L, et al. Convex aspheric surface testing method using an autocollimation lens
  [J]. Acta Optica Sinica, 2020, 40(8): 0822001.
  威丽丽,郑列华,叶璐,等. 自准校正单透镜检验凸
  非球面的方法研究[J].光学学报, 2020, 40(8): 0822001.
- [4] Zhao P W, Zhang J P, Ye L, et al. Catadioptric testing of large aperture convex hyperboloid surfaces
  [J]. Acta Optica Sinica, 2019, 39(11): 1122003.
  赵鹏玮,张金平,叶璐,等.折反射检验大口径凸双曲面的研究[J].光学学报,2019,39(11): 1122003.
- [5] Chen X, Liu W Q, Kang Y S, et al. Design and tolerance analysis of Offner compensator [J]. Optics and Precision Engineering, 2010, 18(1): 88-93.
  陈旭,刘伟奇,康玉思,等. Offner 补偿器的结构设计与装调[J]. 光学 精密工程, 2010, 18(1): 88-93.
- [6] Li K X, Yuan L Y, Hao P M, et al. Design of null compensator to concave aspheric mirror with large diameter and large relative aperture [J]. Optical Instruments, 2009, 31(4): 44-48.
  李可新,袁立银,郝沛明,等.大口径大相对孔径非 球面凹镜的零位补偿器设计[J].光学仪器, 2009, 31(4): 44-48.
- [7] Zhao C C, Hu M Y, Zhang S W, et al. Research on compensation testing method for large-aperture and high-order aspheric surface [J]. Laser &. Optoelectronics Progress, 2020, 57(7): 072203.
  赵础矗,胡明勇,张少伟,等.大口径高次非球面补 偿检测方法的研究[J]. 激光与光电子学进展, 2020, 57(7): 072203.
- [8] Yao J G, Zhang J P, Zheng L H, et al. Study on interference null compensator testing[J]. Acta Optica Sinica, 2015, 35(6): 0622003.
  姚劲刚,张金平,郑列华,等.干涉零位补偿检验研 究[J].光学学报, 2015, 35(6): 0622003.
- [9] Hu W Q, Ye L, He Y, et al. Catadioptric null compensation test of a concave paraboloidal mirror with 4 m aperture[J]. Chinese Journal of Quantum Electronics, 2017, 34(4): 394-399.
  胡文琦,叶璐,何勇,等. \$4 m 口径凹抛物面镜折反 零位补偿检验[J]. 量子电子学报, 2017, 34(4): 394-399.
- [10] Pan J H. Optical aspheric design, fabrication and test
  [M]. Beijing: Science Press, 1994: 71-79.
  潘君骅.光学非球面的设计、加工与检验[M].北京:
  科学出版社, 1994: 71-79.

- [11] Zhang L, Hu W Q, Zheng L H, et al. Catadioptric null compensating test [J]. Acta Photonica Sinica, 2016, 45(7): 1222001.
  张珑,胡文琦,郑列华,等. 折反射式零位补偿检验 [J]. 光子学报, 2016, 45(7): 1222001.
- [12] He Y H, Li Q, Gao B, et al. Measurement of the transmission wavefront of a large-aperture aspheric lens based on computer-generated hologram [J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2019, 56(2): 021202.
  何字航,李强,高波,等.基于计算全息元件的大口 径非球面透镜透射波前检测方法[J].激光与光电子 学进展, 2019, 56(2): 021202.
- [13] Xie Y, Chen Q, Wu F, et al. Concave aspherical surface testing with twin computer-generated holograms[J]. Acta Optica Sinica, 2008, 28(7): 1313-1317.
  谢意,陈强,伍凡,等.用双计算全息图检测凹非球面[J].光学学报, 2008, 28(7): 1313-1317.
- [14] Wang X K, Zhang X J, Wang L H, et al. Mathematical model and simulation for testing aspheric surface by annular subaperture stitching interferometry[J]. Optics and Precision Engineering, 2006, 14(4): 527-532.
  王孝坤,张学军,王丽辉,等.环形子孔径拼接干涉 检测非球面的数学模型和仿真研究[J].光学 精密工 程, 2006, 14(4): 527-532.
- [15] Wang X K, Wang L H, Zhang X J. Testing asphere by subaperture stitching interferometric method [J]. Optics and Precision Engineering, 2007, 15(2): 192-198.
  王孝坤,王丽辉,张学军.子孔径拼接干涉法检测非
- [16] Zhang Y M. Apllied optics [M]. 3rd ed. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2008: 18-21.
  张以谟.应用光学[M].3版.北京:电子工业出版 社, 2008: 18-21.

球面[J]. 光学 精密工程, 2007, 15(2): 192-198.

- [17] Hao P M. Design of auxiliary optical system of aspherical testing[M]. Beijing: Science Press, 2017: 13-16.
  郝沛明.非球面检验的辅助光学系统设计[M]. 北
- 京:科学出版社,2017:13-16. [18] Lin D J. Design of optical engineering system [M]. Beijing: China Machine Press, 1987:41-67. 林大键.工程光学系统设计[M].北京:机械工业出版社,1987:41-67.
- [19] Malacara D. Optical shop testing [M]. Yang L, Wu
  F, et al., Transl. 3rd ed. Beijing: China Machine
  Press, 2012: 340-343.
  Malacara D. 光学车间检测 [M]. 杨力, 伍凡, 等,
  译.3版. 北京: 机械工业出版社, 2012: 340-343.